

- [3] L e s a u x G., R o o s e n G., B r u n A. - Opt. Comm., 1986, v. 56, N 6, p. 374-378.
- [4] P e t r o v M.P., S t e p a n o v S.I., P e n-
s h e v a T.C. - J. Optics (Paris), 1981, v. 12,
N 5, p. 287-292.
- [5] F e r r i e r J.L., G a s e n g e l J.,
N g u e n P h u X., R i v o i r e J. - Opt.
Comm., v. 58, N 5, p. 343-348.
- [6] A c t r a t o v B.N., I l' y i n s k i j A.B., M e l' y-
n i k o v M.B. - F T T, 1983, t. 25, № 7, c. 2163-2168.
- [7] P e t r o v M.P., S h l a e v s k i j H.O., P e t r o v B.M. - J T F, 1985,
t. 55, № 11, c. 2247-2249.
- [8] K o l' y e r P., B e r k h a r t K., L i n L. O p t i c h-e
s k a y a g o l o g r a f i j a. M.: M i r, 1973. 686 c.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию
29 июля 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 23

12 декабря 1988 г.

АКУСТОЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ $ZnS:Mn$

В.Е. Родионов, С.Ф. Терехова,
Н.С. Черная

Электролюминесцентное (ЭЛ) свечение в тонкопленочных МДПДМ структурах на основе $ZnS:Mn$ возникает путем ударного возбуждения ионов Mn^{2+} баллистически ускоренными электронами до энергии ≥ 2.5 эВ, генерируемыми знакопеременным электрическим полем (E). До последнего времени считалось, что порог по баллистическому ускорению E_a выше порога по образованию свободных электронов E_f . Однако снижение порога зажигания U_p электролюминесценции под действием ультрафиолетового излучения показало [1], что E_a может быть выше, чем E_f .

В настоящей работе обнаружено новое явление в ЭЛ структурах на основе $ZnS:Mn$ - акустоэлектролюминесценция, которое выражалось в появлении под действием ультразвуковых (УЗ) колебаний до-порогового свечения при $U_B < U_p$ и в низкопольевой области вольт-яркостных характеристик (ВЯХ): здесь U_B - напряжение, возбуждающее электролюминесценцию.

Исследуемые структуры изготавливались на стеклянных подложках последовательным нанесением слоев. Активным компонентом являлась текстурированная по оси роста пленка $ZnS:Mn$, в качестве

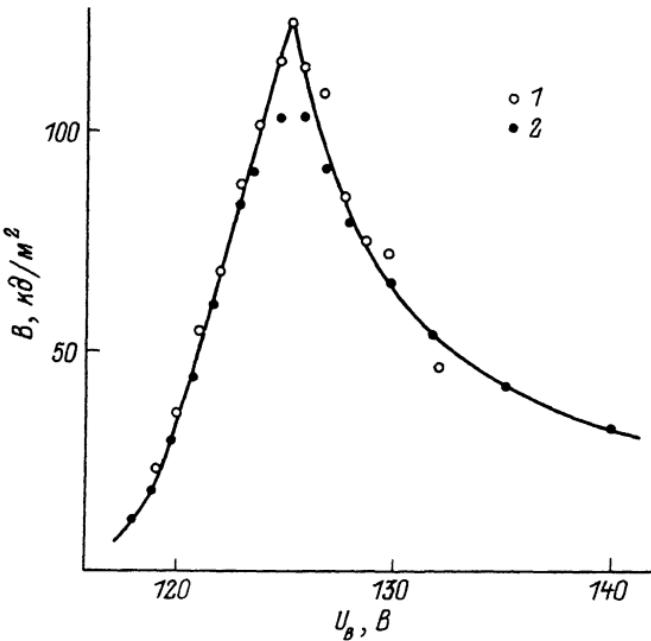


Рис. 1. Типичные зависимости В от U_B . $U_0 = 120$ В, 1 – 1.6 МГц, 2 – 3.85 МГц.

диэлектрических слоев использовались Al_2O_3 , SiO_2 , Y_2O_3 . УЗ колебания вводились в структуру в непрерывном режиме со стороны свободной поверхности перпендикулярно плоскости слоев. Удельная мощность (W) потока составляла 0.1–0.3 Вт/см². Электролюминесценция возбуждалась в синусоидальном режиме на частоте 5 кГц и регистрировалась фотометрическим методом.

При подаче на структуру опорного возбуждающего напряжения (U_0) на 6–10 В ниже порогового при одновременном возбуждении в ней УЗ колебаний наблюдалось добавочное свечение, которое исчезало в отсутствие напряжения U_0 – акустоэлектролюминесцентное (АЭЛ) свечение. Яркость его (В), определяемая как $B = B_{\text{УЗ}} - B_0$ (индексы „уз“ и „0“ соответствуют наличию и отсутствию УЗ колебаний), в зависимости от величины U_B представляла собой кривую с максимумом (рис. 1). Местоположение последнего на шкале U_B не зависело ни от частоты (f), ни от величины напряжения ($U_{\text{УЗ}}$) на УЗ преобразователе, в то время как снижение величины U_B под действием УЗ колебаний росло с увеличением $U_{\text{УЗ}}$ и f . Почти полная идентичность спектральных характеристик свечения структур при наличии и при отсутствии УЗ колебаний (рис. 2) свидетельствует о том, что УЗ колебания не приводили к изменению центров, ответственных за ЭЛ свечение в слое Y_2SiO_5 . Величина интенсивности УЗ колебаний была недостаточной для возбуждения в

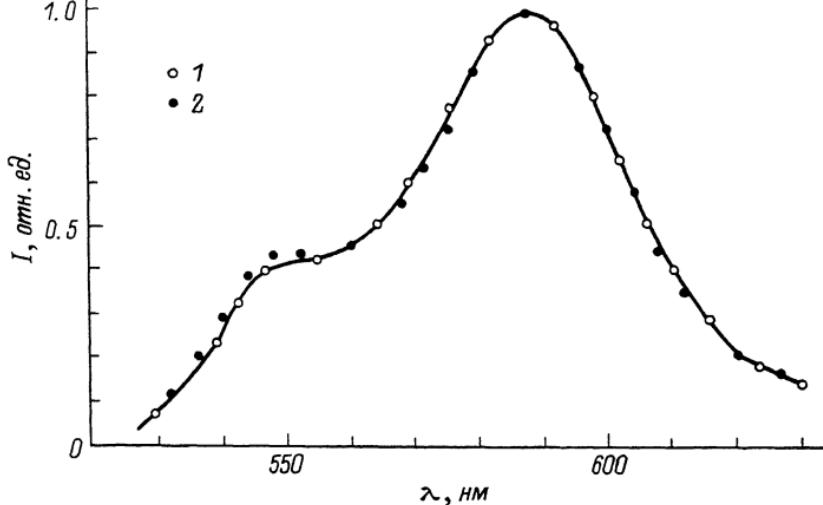


Рис. 2. Спектральные характеристики свечения структур при $\mathcal{U}_B = kE_{max}$: 1 - при отсутствии и 2 - при наличии УЗ колебаний ($W = 0.1 \text{ Вт/см}^2$, $f = 1.6 \text{ МГц}$). Кривая 2 снята при 6-кратном ослаблении.

слое ZnS внутрицентровой акустолюминесценции [2]. Таким образом, УЗ воздействие не могло снизить порог \mathcal{U}_p . По-видимому, как и в работе [1], имело место неравенство $E_a < E_t$ и роль УЗ колебаний в снижении порога \mathcal{U}_p состояла в уменьшении величины E_t , т.е. УЗ воздействие вызывало генерацию первичных электронов в допороговой области ВЯХ, а подаваемое на структуру напряжение \mathcal{U}_B было достаточным для сообщения им энергии $\geq 2.5 \text{ эВ}$, необходимой для возбуждения иона Mn^{2+} . Роль УЗ колебаний в возникновении АЭЛ свечения состояла в образовании или активации квазистабильных поверхностных электронных состояний (ПЭС) [3] на границах раздела ZnS -диэлектрик, а также на поверхности зерен в пленке ZnS . Энергия активации таких ПЭС может быть ниже энергии активации ПЭС, которые являются поставщиками электронов в обычном явлении электролюминесценции. Ввод в действие ПЭС с меньшей энергией активации облегчает туннелирование электронов с них в зону проводимости, что обуславливает более низкое значение E_t .

Яркость АЭЛ свечения структур на основе $ZnS:Mn$ (при фиксированных толщине пленки ZnS и содержания марганца в ней) с учетом данных работы [4] и в пренебрежении эффектом размножения электронов в низкополевой области ВЯХ может быть представлена выражением

$$B = AN(E) \exp\left[-\frac{\beta_1 \gamma_{yz}^{3/2}}{E}\right] \exp\left[-\frac{\beta_2}{E^\pi}\right], \quad (1)$$

где $N(E) \exp\left[-\frac{b_1 \gamma_{yz}^{3/2}}{E}\right]$ – член, связанный с генерацией первичных электронов, $N(E)$ и γ_{yz} – концентрация и глубина залегания ПЭС соответственно; $E = kU_B$, k – коэффициент, учитывающий толщину слоя ZnS и перераспределение U_B между слоями структуры, $b_1 = \frac{4/3(2m^*)^{1/2}}{qh}$, m^* – эффективная масса (для ZnS $0.3m_e$), m_e – масса электрона, q – заряд электрона, h – постоянная Планка, $\exp\left[-\frac{b_2}{E_n}\right]$ – член, ответственный за возбуждение иона m_n^{2+} , b_2 – постоянные коэффициент, n – показатель, принимающий значения 1 или 0.5, A – постоянный множитель.

Приравняв производную $\frac{dN}{dE}$ нулю, в предположении параболической зависимости N от E при условии более крутого роста члена $N(E)$ по сравнению с $\exp\left(-\frac{b_2}{E^n}\right)$ получим выражение для определения энергии активации ПЭС, обусловливающих АЭЛ:

$$\gamma_{yz} = \left(\frac{2E_{max}}{b_1}\right)^{3/2}, \quad (2)$$

где E_{max} – значение E , соответствующее максимальной величине В. На основании выражения (2) получаем глубину залегания ПЭС, ответственных за АЭЛ, равную 0.62 эВ, что укладывается в интервал значений энергии активации эмиссии электронов с ПЭС в структурах на основе ZnS [4].

Обнаруженное явление помимо самостоятельного интереса может найти практическое применение.

Л и т е р а т у р а

- [1] Müller G.O. – Phys. Stat. Sol. (a), 1984, N 81, p. 597–608.
- [2] Жмурко А.И., Рожко А.Х. – Письма в ЖТФ, 1984, т. 10, в. 14, с. 889–892.
- [3] Howard W.E. – J. Luminescence, 1981, v. 24/25, p. 835–842.
- [4] Smith D.H. – J. Luminescence, 1981, v. 23, N 1–2, p. 209–235.

Поступило в Редакцию
28 июня 1988 г.